Electrocapilaridad

Capacitancia

superficie (AFM)

TÉCNICAS DE MEDICIÓN DE FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN SUPERFICIES

Juan Barbosa Fisicoquímica avanzada

Contenidos

Introducciór

Electrocapilaridad

Capacitancia

- 1 Introducción
- 2 Electrocapilaridad
- 3 Capacitancia
- 4 Fuerzas en la superficie (AFM)

Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

- Fenómenos eléctricos: asociados a la presencia y movimiento de materia con carga eléctrica.
- Superficie: es la capa más externa de un objeto, en ella tienen lugar las interacciones del objeto con los alrededores.

Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf y Michael Kappl. *Physics and chemistry of interfaces*. John Wiley & Sons. 2006

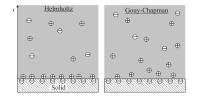
Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

Fuerzas en 1a superficie (AFM)

- Los primeros estudios se llevaron acabo usando superficies cargadas en sólidos.
- Distintos modelos han sido propuestos para describir las superficies cargadas.



■ En general, las cargas superficiales ocasionan un campo eléctrico, el cual atrae cargas opuestas. La capa de cargas y contraiones se denomina doble capa eléctrica.

Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM) El modelo de Helmholtz es el más simple de todos.

| Teoría | Características | Aproximaciones |
|--------------|--|---|
| Helmholtz | La carga total de la superficie es neutra- lizada por contraio- nes. El potencial dis- minuye linealmente. | vimiento térmico, di- |
| Gouy-Chapman | Tiene en cuenta los movimientos térmi- cos | Carga uniforme en la superficie, cargas puntuales |

Estadística de Boltzmann

Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM)

$$\frac{\langle N_i \rangle}{N} = \frac{g_i}{e^{(E_i - \mu)/kT}} \longrightarrow \left(\frac{g_i}{Z}\right) e^{-E_i/kT} \tag{1}$$

Considerando el volumen total en solución, es posible asociar una distribucción de concentraciones.

$$\frac{\langle N_i \rangle}{N} \left(\frac{N}{V N_A} \right) = \left(\frac{g_i}{Z} \right) \left(\frac{N}{V N_A} \right) e^{-E_i/kT} \tag{2}$$

$$\frac{\langle N_i \rangle}{V N_A} = \frac{n}{V} = c_i = c_{0_i} e^{-E_i/kT} \tag{3}$$

Ecuación de Poisson

Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM) Describe el potencial causado por una distribucción de densidad de carga o masa (ρ) .

$$\Delta \psi = \nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon \epsilon_0} \tag{4}$$

La energía corresponde con:

$$E_i = z_i e \psi \longleftarrow U = qV \tag{5}$$

Usando (3) es posible obtener la densidad de carga:

$$\rho = \sum (z_i e) c_i = \sum (z_i e) c_{0_i} e^{-(z_i e)\psi/kT}$$
 (6)

El potencial eléctrico está dado por:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{\rho}{\epsilon \epsilon_0} = -\frac{\sum (z_i e) c_{0i} e^{-(z_i e)\psi/kT}}{\epsilon \epsilon_0}$$
 (7)

Ecuación de Poisson

Introducción

Electrocapilaridad

Capacitancia

Fuerzas en 1a superficie (AFM) Para un catión y anión monovalentes:

$$\nabla^2 \psi = -\frac{ec_0 e^{-e\psi/kT} - ec_0 e^{e\psi/kT}}{\epsilon \epsilon_0} \tag{8}$$

$$\nabla^2 \psi(x, y, z) = \frac{ec_0}{\epsilon \epsilon_0} \left(e^{e\psi(x, y, z)/kT} - e^{-e\psi(x, y, z)/kT} \right)$$
(9)

- La ecuación anterior corresponde con la ecuación de Poisson-Boltzmann y en la mayoría de los casos debe ser resuelta numéricamente.
- Describe matemáticamente una doble capa eléctrica.

Electrocapilaridad

Capacitancia

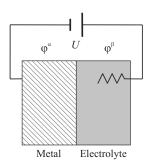
Fuerzas en la superficie (AFM) Existen múltiples técnicas para medir las propiedades de dobles capas eléctricas.

- Electrocapilaridad: tensión interfacial en función del potencial de una superficie metálica.
- Capacitancia: permiten determinar las densidades de carga superficiales.
- Fuerzas en la superficie: determinar la dependencia de la doble capa eléctrica con la distancia.

Introducciór

Electrocapilarid

Capacitancia



- Permite obtener información detallada de la doble capa eléctrica.
- El cambio en la tensión interfacial, entre un metal/electrolito, se determina al cambiar un potencial aplicado.

Introducciór

Electrocapilarid

Capacitancia

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i}^{*} - \Gamma_{e} d\mu_{e}^{*} \qquad (10)$$

$$d\mu_j^* = d\mu_j + Z_j F_A d\psi \qquad (11)$$

- Γ_i = N_i/A,
 Concentración de exceso interfacial del ion i.
- μ_i potenciales químico, y μ_i* electroquímico del ion i.
- Z_i carga del ion i.
- $m{\psi}$ potencial eléctrico.

$$\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i}^{*} = \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} (d\mu_{i} + Z_{i} F_{A} d\psi) = \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i} + \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} Z_{i} F_{A} d\psi$$
 (12)

Introducción

Electrocapilarid.

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM)

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_i d\mu_i - F_A \sum_{i=1}^{n} \Gamma_i Z_i d\psi - \Gamma_e d\mu_e + F_A \Gamma_e d\psi \qquad (13)$$

Se consideran ahora dos potenciales, uno por cada fase $\alpha \to {\rm metal}$ y $\beta \to {\rm líquido}.$

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i} - F_{A} \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} Z_{i} d\psi^{\beta} - \Gamma_{e} d\mu_{e} + F_{A} \Gamma_{e} d\psi^{\alpha}$$
 (14)

El sistema se considera eléctricamente neutro.

$$\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} Z_{i} = \Gamma_{e} \tag{15}$$

Introducciór

Electrocapilarida

Capacitancia

Fuerzas en la superficie

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i} - F_{A} \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} Z_{i} d\psi^{\beta} - \Gamma_{e} d\mu_{e} + F_{A} \sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} Z_{i} d\psi^{\alpha}$$
 (16)

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_i d\mu_i - \Gamma_e d\mu_e - F_A \sum_{i=1}^{n} \Gamma_i Z_i d(\psi^\beta + \psi^\alpha)$$
 (17)

$$d\gamma = -\sum_{i=1}^{n} \Gamma_{i} d\mu_{i} - \Gamma_{e} d\mu_{e} - \sigma d(\psi^{\beta} + \psi^{\alpha})$$
 (18)

$$\frac{d\gamma}{d(\psi^{\beta} + \psi^{\alpha})} = \frac{d\gamma}{dU} = -\sigma = \frac{\gamma}{U}$$
 (19)

Donde σ corresponde con la densidad superficial de carga.

Introducción

Electrocapilarid

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM) Para un capacitor:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{dQ}{dV} \tag{20}$$

$$\frac{C}{A} = C^A = \frac{dQ/dA}{dU} = \frac{d\sigma}{dU} = -\frac{d^2\gamma}{dU^2}$$
 (21)

Experimentalmente se tiene:

$$\int_{\gamma_0}^{\gamma} d\gamma = \int_{0}^{U} \left(\frac{d\gamma}{dU'}\right) dU' = \int_{0}^{U} -\sigma dU' = \int_{0}^{U} -C^A U' dU' = -\frac{1}{2}C^A U^2$$
(22)

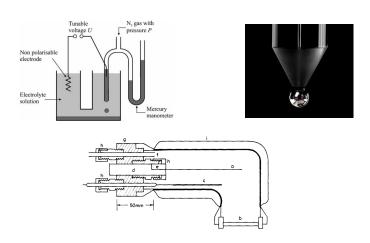
$$\gamma = \gamma_0 - \frac{1}{2}C^A U^2 \tag{23}$$

Introducciór

Electrocapilarid

Capacitancia

Fuerzas en la superficie (AFM)



Butt, Graf y Kappl, Physics and chemistry of interfaces

RA Fredlein y Bockris JO'M. "An "electrocapillary" study of the gold-perchloric acid solution interface".

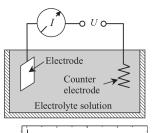
Cronoamperometría

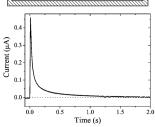
troducciór

Electrocapilaridad

Capacitancia

superficie (AFM)





Permite obtener el valor de capacitancia para una interface.

$$I = I(t) = \frac{Q}{t} = \frac{dQ}{dt} \qquad (24)$$

$$\int_{-}^{t} I(t')dt' = \int_{-}^{t} \frac{dQ}{dt'}dt' = Q \quad (25)$$

$$C = \frac{Q}{U} \longrightarrow \sigma = \frac{Q}{A}$$
 (26)

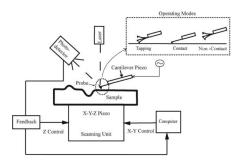
Butt, Graf y Kappl, Physics and chemistry of interfaces

Fuerzas en la superficie (AFM)

Introducciór

Electrocapilaridad

Capacitancia



- Desarrollado por Gerd Binning y colaboradores en 1985.
- Una punta conductora puede actuar como un electrodo móvil.

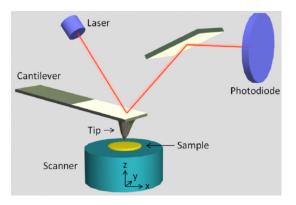
Alba Avila y Bharat Bhushan. "Electrical measurement techniques in atomic force microscopy". En: Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 35.1 (2010), págs. 38-51

Fuerzas en la superficie (AFM)

Introducciór

Electrocapilaridad

Capacitancia



Fuerzas en la superficie (AFM)

TABLE 2 Equivalent terminology and acronyms used for electrical measuremen

Electrocapilaridad

Capacitancia

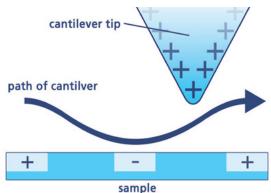
| Name | Common names | Acronyms | Reference |
|------------------------------------|--|----------|-----------|
| Scanning Kelvin force microscopy | | SKFM | 45 |
| 3 | Scanning Kelvin probe force microscopy | SKPFM | 46,47 |
| | Scanning Kelvin probe microscopy | SKPM | 48 |
| | Scanning Kelvin microscopy | SKM | 49 |
| | Scanning electric potential microscopy | SEPM | 50 |
| | Kelvin probe force microscopy | KPFM | 3,12,21 |
| | Surface electric potential microscopy | SEPM | 51 |
| | Scanning Kelvin probe microscopy | SKP | 12 |
| | Scanning surface potential microscopy | SSPM | 12 |
| Scanning impedance microscopy | | SIM | 24 |
| | Scanning impedance probe microscopy | SIPM | 52 |
| Scanning capacitance microscopy | | SCM | 25,29 |
| | Scanning capacitance force microscopy | SCFM | 7 |
| | Scanning capacitance microscopy | SCaM | 30,53,54 |
| | 0 1 | SCAM | |
| Piezo response force microscopy | | PFM | 25 |
| , | Piezo force microscopy | PFM | 55 |
| | Piezoresponse imaging | PRI | 13 |
| Conductive atomic force microscopy | | CAFM | 56 |
| | Conductive probe atomic force microscopy | CPAFM | 57 |
| | Scanning resistance microscopy | SRM | 58 |
| Scanning gate microscopy | | SGM | 11 |

Avila y Bhushan, "Electrical measurement techniques in atomic force microscopy"

Electrostatic force microscopy (EFM)

Electrocapilaridad

Fuerzas en la superficie (AFM)



$$F = \frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial z} \Delta V^2 \tag{27}$$

Avila y Bhushan, "Electrical measurement techniques in atomic force microscopy"